

电子元器件静电放电 (ESD) 和闩锁 (Latch-up) 测试及分析技术研讨会

FREE

各相关单位:

静电放电 (ESD) 和闩锁效应 (Latch-up) 是导致集成电路在生产和应用过程中失效的两大主要原因; 其他大量的电子元器件也对 ESD 非常敏感, 如光电器件、射频和微波器件、声表面波器件、纳米器件等。

为让更多的行业人员进一步了解和掌握电子元器件 ESD 和 Latch-up 检测及分析技术方面的相关知识, 避免和减少企业因静电导致的损失, 本实验室拟以“电子元器件 ESD 和 Latch-up 测试及分析技术”为主题, 举办为期一天的技术研讨会。

欢迎有关管理人员与技术人员参加!

时间: 2007 年 4 月 21 日 **地点:** 广州市天河区东莞庄路 110 号 电子五所院内

费用: 免费 **餐食:** 提供免费午餐

日程安排:

时间	研讨内容	演讲者
9:30~12:00	电子元器件 ESD 测试及分析技术 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 电子元器件 ESD 基础知识 ➢ ESD 检测标准、方法及与整机 ESD 试验的比较 ➢ ESD 损伤的失效定位及分析技术 ➢ ESD 损伤典型案例分析 	来萍
12:00~13:30	免费午餐	
13:30~14:50	先进的聚焦离子束 (FIB) 系统及分析技术 <ul style="list-style-type: none"> ➢ FIB 系统的基本原理 ➢ FIB 分析技术的系统功能及用途 ➢ FIB 分析技术的具体应用范围 	费庆宇
14:50~15:00	茶歇	
15:00~16:30	半导体器件与集成电路抗静电放电 (ESD) 设计 <ul style="list-style-type: none"> ➢ ESD 产生的机理及其适用标准 ➢ ESD 损伤途径及其保护电路设计 ➢ 电子系统设备中的抗 ESD 设计规则 ➢ 抗 ESD 的 PCB 板布局布线设计 ➢ 采用外接 ESD 保护电路需注意的几个问题 	罗宏伟
16:30~17:00	参观中国赛宝实验室分析中心 (电子元器件可靠性物理及其应用技术国家级重点实验室)	

演讲者介绍:

来萍, 高级工程师, 现在中国赛宝实验室 (信产部电子第五研究所) 可靠性分析中心从事半导体器件与集成电路可靠性工作。中国电子学会高级会员, 华南理工大学和广东工业大学兼职硕士指导教师。主要专业领域: 微波器件和电路的可靠性研究, 半导体器件和集成电路的抗静电放电 (ESD) 检测及防护技术研究, 以及半导体器件的失效分析和可靠性评估技术研究。

从 2001 年开始, 开设了关于电子元器件抗 ESD 损伤技术方面的培训课程, 曾给华为电气技术公司、北方电讯、苏州明基、东莞新进、惠州联想、广州日立、佛山普立华等大型电子企业以及中电集团多个厂所进行了内部培训, 还在广州、深圳、苏州等地举办了多次公开课, 参加培训的有全国各地几十家电子企业的有关技术和管理人员。在开设培训课的同时, 也为多个企业生产线的静电防护工作提供咨询。

罗宏伟，中国赛宝实验室（信产部电子第五研究所）可靠性分析中心高级工程师，博士，主要从事微电子产品失效模式、失效机理、可靠性试验和评价技术、可靠性设计等方面的研究，承担或参加了多项国家科研项目，曾获省、部级科技进步奖多项。多次完成微电子失效元器件的失效机理分析及其失效预防措施研究，在微电子产品的可靠性试验评价和设计方面具有丰富的经验，在公开技术刊物和学术会议上发表多篇论文。

费庆宇，高级工程师。1982年起在中国电子产品可靠性与环境试验研究所（现名：信息产业部电子第五研究所）工作。长期从事半导体器件（包括集成电路和 GaAs 微波器件等）的失效机理和失效分析技术研究。分别于 1989 年、1992—1993 年、2001 年由联合国、国家教委和中国国家留学基金委员会资助赴联邦德国、加拿大和美国作访问学者。曾在国内外刊物和学术会议上发表论文三个余篇。曾多次应邀外出讲学，曾多次主持重大课题研究，他主持的《VLSI 失效分析技术》课题荣获 2003 年度国防科技二等奖。

FREE

联系方式：

联系人：熊娥英 电话：020-87236986 传真：020-87237185
 网址：www.rac.ceprei.com E-mail：xiongey@ceprei.com

回 执 表

单位名称		人数	
参与人员姓名			
职位/岗位		公司产品	
电话		传真	
电子邮件			
您感兴趣的问题：(表格可自制)			

#: 研讨会免费参加，每单位限 2 人以内，总名额限制为 100 名，以报名先后为准，确认后有效。

#: 参加人员来访路线(也可访问：www.rac.ceprei.com)

